

202412-V1.

特点:

● 频率范围:装配方式一 0.3~3.0GHz 装配方式二 0.03~3.0GHz

- 增益:
 - +5.00V@35mA, 装配方式一, 典型值 23dB
 - +5.00V@35mA, 装配方式二, 典型值 23dB
- 噪声系数:
 - +5.00V@35mA, 装配方式一, 典型值 0.8dB
 - +5.00V@35mA,装配方式二,典型值 0.8dB
- 1dB 压缩点输出功率:
 - +5.00V@35mA, 装配方式一, 典型值 21.5dBm
 - +5.00V@35mA, 装配方式二, 典型值 21.5dBm
- GaAs裸片
- 芯片尺寸: 1.0mm×1.0mm×0.1mm

产品简介:

YDC1180 是一款采用 GaAs 工艺设计制造的低噪声放大器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理,适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺,芯片均经过在片 100%直流与RF 测试。

性能参数 1: (50Ω系统, T_A=+25℃, 装配方式一, 无需外加隔直)

			参数值 常温(+25℃) 全温					
参数名称	符号	测试条件			全温	単位	备注	
			MIN	TYP	MAX	-55℃~+85℃		
频率范围	f		0.3	-	3.0	0.3~3.0	GHz	-
增益	G		21	23	24	20.0~24.0	dB	-
增益平坦度	ΔG	$V_D = +5.00V$	-	1.2	2.0	≤2.0	dB	-
输入驻波比	$VSWR_{\rm I}$	f=0.3~3.0GHz	-	1.3:1	2.0:1	≤2.0:1	-	-
输出驻波比	VSWRo	P _{IN} =-30dBm	-	1.4:1	2.0:1	≤2.0:1	-	-
噪声系数	NF		-	0.8	1.2	≤2.0	dB	-
反向隔离度	I_R		22	28	-	≥22	dB	-
1dB 压缩点输出功率	OP _{1dB}	V _D =+5.00V	+20	+21.5	-	≥+19	dBm	-
输出三阶截点 [©]	OIP ₃	f=0.3~3.0GHz	+25	+30	-	≥+25	dBm	-
电源电压	V_{D}	-	+4.75	+5.00	+5.25	+4.75~+5.25	V	功能正常
工作电流	I_D	$V_D = +5.00V$, $P_{IN} = -30$ dBm	-	35	45	≤60	mA	静态电流

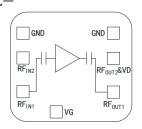
① 输出三阶截点测试条件:双音信号间隔 1MHz,单音信号功率 0dBm。

性能参数 2:(50Ω系统,TA=+25℃,装配方式二,需外加隔直)

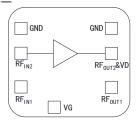
			参数值					
参数名称	符号	测试条件	常溫	温(+25 °	C)	全温	单位	备注
			MIN	TYP	MAX	-55℃~+85℃		
频率范围	f	V - 15 00V	0.03	-	3.0	0.03~3.0	GHz	-
增益	G	$V_D = +5.00V$	21	23	24	20.0~24.0	dB	-
增益平坦度	ΔG	f=0.03~3.0GHz	-	1.2	2.0	≤2.0	dB	-
输入驻波比	VSWR _I	P _{IN} =-30dBm	-	1.2:1	1.6:1	≤1.6:1	1	-

装配方式一

功能框图:



装配方式二

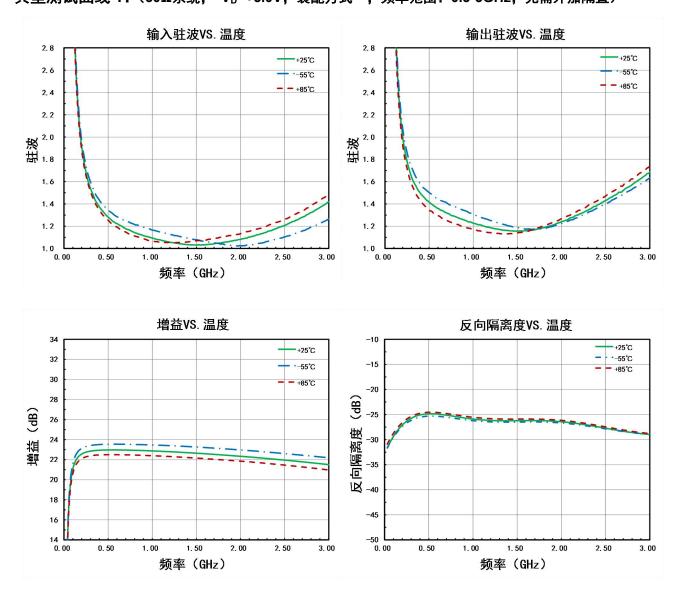






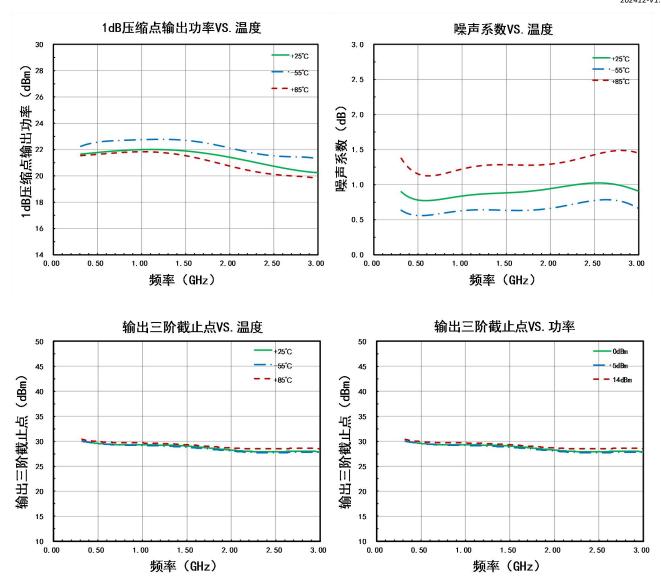
输出驻波比	VSWRo		-	1.4:1	1.8:1	≤1.8:1	1	-
噪声系数	NF		-	0.8	2.0	≤2.0	dB	-
反向隔离度	I_R		20	25	-	≥20	dB	-
1dB 压缩点输出功率	OP_{1dB}	V _D =+5.00V	+20	+21.5	-	≥+19	dBm	-
输出三阶截点 [©]	OIP ₃	f=0.03~3.0GHz	+25	+30	-	≥+25	dBm	-
电源电压	V_D	-	+4.75	+5.00	+5.25	+4.75~+5.25	V	功能正常
工作电流	I_D	$V_D = +5.00V$, $P_{IN} = -30$ dBm	-	35	45	≤60	mA	静态电流

② 输出三阶截点测试条件:双音信号间隔 1MHz,单音信号功率 0dBm。

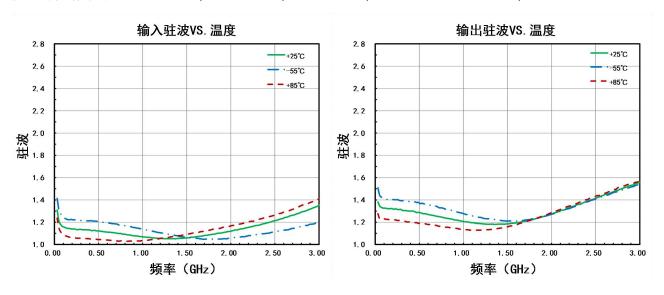






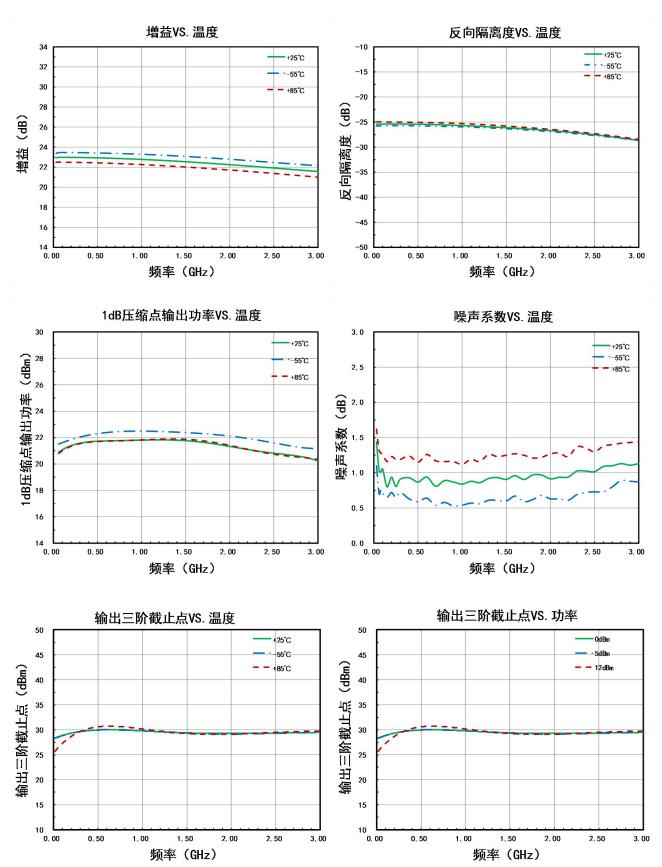


典型测试曲线 2:(50Ω系统, VD=+5.0V,装配方式二,频率范围:0.03-3GHz,需外加隔直)



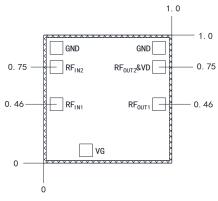








外形尺寸图:

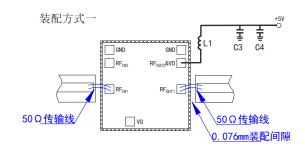


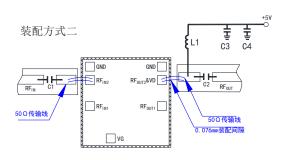
注: 1.单位: mm;

- 2.芯片背面镀金;
- 3.键合压点镀金,尺寸: 0.1×0.1mm;
- 4.外形尺寸公差: ±0.05mm。



推荐装配图:





注:射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸,典型的装配间隙是 $0.076\sim0.152$ mm,使用 Φ 25um 双金丝键合,建议金丝长度 250~400um。

引脚定义:

3101707				
符号	描述			
RF _{IN1}	射频输入,芯片内部有隔直			
RF _{OUT1}	射频输出,芯片内部有隔直			
RF _{IN2}	射频输入,芯片内部无隔直			
DE 677D	射频输出,芯片内部无隔直			
RF _{OUT2} &VD	电源端口			
VG	电流调试焊盘			
GND/芯片背面	接地			

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率.50Ω	+20dBm
电源电压	+6V
装配温度	+300℃, 20s
工作温度	-55°C∼+85°C
贮存温度	-55°C∼+150°C

超过以上任何一项极限参数,可能造成器件永久损坏。

推荐应用电路器件值:

- 10 (— 11) OF A AA 11 (— 1					
位号	推荐值/推荐型号	备注			
C1、C2	0.1uF				
С3	10nF				
C4	1uF				
L1	0402FSJ-1R0K (嘉擎电子)	电流≥100mA			

注:分段使用时,可根据使用频段调整隔直电容和馈电电感值。



202412-V1 0



产品使用注意事项:

- 1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储,在超净环境装配使用。
- 2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆,芯片表面容易受损,不能用干或湿化学方法清洁芯片表面,使用时须小心。
- 3. 芯片粘结装配时,需考虑热膨胀应力对芯片的影响,芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上,如可伐、钨铜或钼铜垫片上,避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
- 4. 芯片使用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过300℃,时间不能超过20秒),使之充分接地。
- 5. 芯片射频端口使用 25um 双金丝键合, 建议金丝长度 0.25~0.40mm (10~16 mils)。
- 6. 在存储和使用过程中注意防静电,烧结、键合台接地良好。